

***Judul:***

Analisa tunnel current pada MOS capasitor dengan ketebalan lapisan oksida 0,6-3nm dengan menggunakan multiple scattering theory (MST) dan boltzman transport equation (BTE)

***Pengarang/Penulis:***

Purba, Taryono, author

***Subjek:***

Electronic apparatus and appliances

***Nomor Panggil:***

S39312

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)